

- Surdetermination

- Nombre d'observations
- Nombre de paramètres
- **Surdétermination**

$$\begin{aligned}\ell & (n \times 1) \\ \mathbf{x} & (u \times 1) \\ r & = n - u \geq 0\end{aligned}$$

- Modèle fonctionnel

- Choix du modèle paramétrique
- Choix des paramètres approchés
- Résidus approchés
- Linéarisation (*analytique* ou *numérique*)

$$\begin{aligned}\ell - \mathbf{v} &= \mathbf{f}(\mathbf{x}) \\ \mathbf{\overset{\circ}{x}} & \\ \mathbf{\overset{\circ}{v}} &= \ell - \mathbf{f}(\mathbf{\overset{\circ}{x}}) \\ \mathbf{A} &= \partial \mathbf{f} / \partial \mathbf{x} \quad \text{en } \mathbf{\overset{\circ}{x}}\end{aligned}$$

- Modèle stochastique

- Écart-type *a priori* σ_0 et cofacteurs $\mathbf{Q}_{\ell\ell}$
- Variances et covariances $\mathbf{K}_{\ell\ell}$

$$\begin{aligned}\mathbf{P} &= (\mathbf{Q}_{\ell\ell})^{-1} \\ \mathbf{P} &= (\mathbf{K}_{\ell\ell})^{-1}\end{aligned}$$

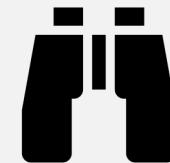
▪ Résidus

- Analyse *globale*: $\hat{\sigma}_0$ *a posteriori* / σ_0 *a priori*
- Analyse *locale*:
 - Détection de fautes: cas particuliers
 - Détection d'erreurs systématiques : tendances
- Adaptation des modèles
 - fonctionnel : autres paramètres, exemple de sinusoïde dans cas 3(c) vs. 4(d)
 - Stochastique : autres variances et corrélations



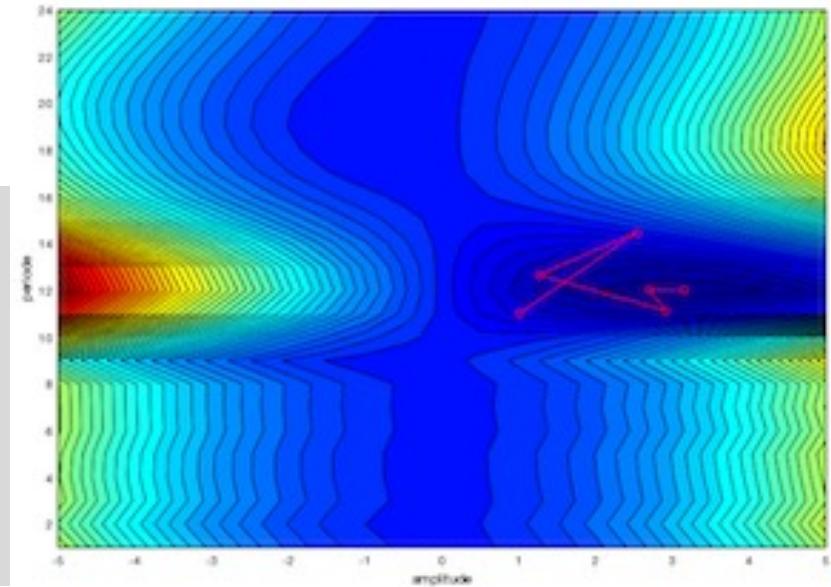
▪ Cofacteurs

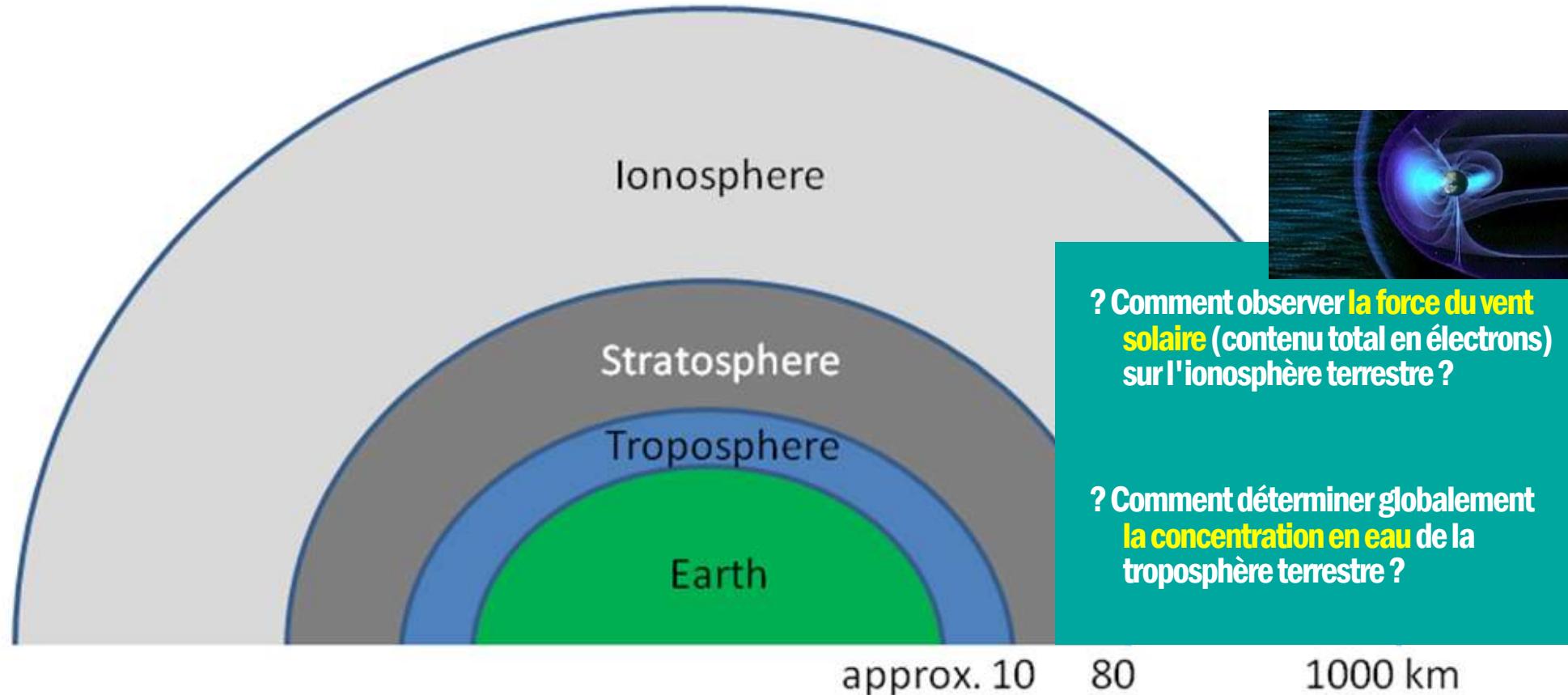
- Paramètres compensés
 - Précision du dispositif de mesure (variances)
 - Capacité de distinguer des paramètres (corrélations)
- Résidus compensés
 - Capacité de détecter des fautes (fiabilité)
- Observations compensées : précision des observations



- Linéarisation – itérations et convergence
 - Résidus approchés, incréments des paramètres
 - Critères: taille des incréments, forme quadratique
 - Choix des paramètres approchés, faux extremum?

- Exemples
 - Cas linéaires:
 - Moyenne arithmétique (rappel)
 - Quadrilatère (exercice interactif)
 - Cas non-linéaire:
 - sinusoïde avec *amplitude* et *période*





19:27

46%

Status



🔒 Lat: 46.5530610° Time: 19:27:07
Long: 6.5553604° TTFF: 15 sec
Alt: 492.0 m E H/V Acc: 12.0/13.0 m
Alt (MSL): 443.9 m # Sats: 7/8/8
Speed: 2.5 m/s Bearing: 217.2°
S. Acc: 1.3 m/s B. Acc: 18.0°
PDOP: 1.2 H/V DOP: 0.6/1.0

19:31

46%

Status



🔒 Lat: 46.5536699° Time: 19:31:39
Long: 6.5547180° TTFF: 15 sec
Alt: 499.0 m E H/V Acc: 30.0/11.0 m
Alt (MSL): 450.8 m # Sats: 6/6/6
Speed: 3.1 m/s Bearing: 318.4°
S. Acc: 2.3 m/s B. Acc: 17.6°
PDOP: 3.2 H/V DOP: 1.6/2.8

Trouver la différence ...
... et si vous comprenez votre téléphone ?

- Pourquoi ?

- Besoin réel
 - On s'intéresse à l'estimation de certains paramètres *seulement*
 - ... mais *l'influence des autres paramètres* doit être prise en compte
 - On veut *optimiser* la compensation de manière séquentielle (dans le temps)

- Comment ?

1. On regroupe les observations en groupes non corrélés
2. On sépare les paramètres en une partie commune à toutes les observations et des parties spécifiques au reste
3. Les calculs sont effectués séparément pour chaque groupe :
 - « poids réduits » $\mathbf{P}_i^* = \mathbf{P}_i - \dots$
 - contribution aux « équations normales » $(\mathbf{A}_i^T \mathbf{P}_i^* \mathbf{A}_i)$ ainsi que le vecteur $\mathbf{A}_i^T \mathbf{P}_i^* \ell_i$
 - nous résolvons le système d'équation réduit avec la contribution accumulée pour les paramètres d'intérêt $(\sum (\mathbf{A}_i^T \mathbf{P}_i^* \mathbf{A}_i)) \cdot \hat{\mathbf{x}} = \sum (\mathbf{A}_i^T \mathbf{P}_i^* \ell_i)$

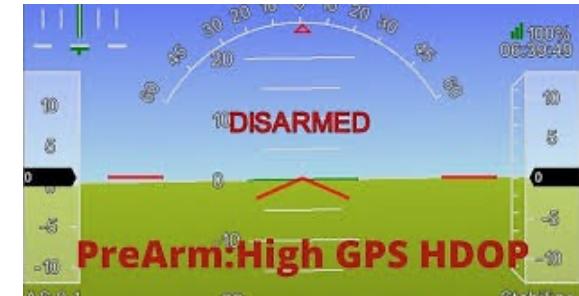
- Concept et application

- Fiabilité **interne** = contrôle mutuel des observations
 - Part de redondance
 - Résidu standardisé = $(\text{quotient local}) / (\text{part de redondance})^{1/2}$
 - Plus petite faute détectable = nabla
- Fiabilité **externe** = effet sur les paramètres
 - Effet de chaque nabla
 - Pour chaque paramètre: effet maximum et sa cause

- Recouplement de distances

- Exemple: la localisation par satellites, analogie avec des poutres en statique
- Calcul et interprétation des cofacteurs
- Ellipses d'erreur et parts de redondance
- Visualisation (SysQuake)

- Cofacteurs des paramètres $\mathbf{Q}_{\hat{x}\hat{x}}$
 - Variances, écarts-types et corrélations
 - Visualisation 2D: *ellipse d'erreur*
 - *Dilusion Of Precision* (DOP)
 - Définition de HDOP, extraite de $\mathbf{Q}_{\hat{x}\hat{x}}$
 - Cercle d'erreur moyenne, rayon $= \sigma_0[\text{m}] \cdot \text{HDOP}[\text{sans dimension}]$
 - *Circular Error Probable* = CEP (50% inside) $\text{CEP}_{95} \approx 2 \cdot \text{CEP}$



- Cofacteurs des résidus $\mathbf{Q}_{\hat{v}\hat{v}}$
 - Pour $\mathbf{P} = \mathbf{I}$: $\text{trace}(\mathbf{Q}_{\hat{v}\hat{v}}) = n - u =$ redondance
 - Élément diagonal = **part de redondance** de la mesure
 - Fiabilité = (auto) capacité de détecter une faute
 - Contrôle de l'intégrité (*Integrity Monitoring*)